



(11) **EP 2 040 050 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**25.03.2009 Patentblatt 2009/13**

(51) Int Cl.:  
**G01J 3/44 (2006.01) G01J 3/02 (2006.01)**  
**G01N 21/17 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01)**

(21) Anmeldenummer: **07018676.2**

(22) Anmeldetag: **24.09.2007**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL BA HR MK RS**

(71) Anmelder: **Universität Potsdam**  
**14469 Potsdam (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Reich, Oliver. Dr.**  
**14471 Potsdam (DE)**  
• **Löhmannsröben, Hans-Gerd, Prof. Dr.**  
**14476 Potsdam-Golm (DE)**

(74) Vertreter: **Bittner, Thomas L.**  
**Forrester & Boehmert**  
**Pettenkoferstrasse 20-22**  
**80336 München (DE)**

(54) **Messanordnung für ein optisches Spektrometer**

(57) Die Erfindung betrifft eine Messanordnung für ein optisches Spektrometer, insbesondere ein Photondichtewellen-Spektrometer, mit einer Messkammer, welche mit einer zu messenden Probe beladbar ist, und einer Ein-/Auskoppeleinrichtung, die konfiguriert ist, Anregungslicht von einer Lichtquelle zu empfangen und auf die zu messende Probe in der Messkammer einzukoppeln und in der zu messenden Probe infolge des eingekoppelten Anregungslichtes gebildetes Messlicht zu empfangen und an eine Detektionseinrichtung abzuge-

ben, wobei die Ein-/Auskoppeleinrichtung eine optische Schalteinrichtung und mehrere hieran koppelnde Lichtleiterelemente mit einem jeweiligen Lichtwellenleiter aufweist, die mittels der optischen Schalteinrichtung gemäß zumindest einer wählbaren Messkonfiguration beschaltbar sind, um der zumindest einen wählbaren Messkonfiguration entsprechend das Anregungslicht einzukoppeln und das Messlicht zu empfangen, und wobei Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente in Blickrichtung auf die Ausgänge einer spiralförmigen Anordnung entsprechend positioniert sind.

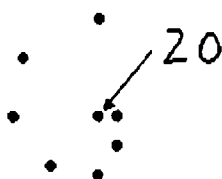


Fig. 2

**EP 2 040 050 A1**

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft eine Messanordnung für ein optisches Spektrometer, insbesondere ein Photonendichtewellen-Spektrometer.

### Hintergrund der Erfindung

**[0002]** Spektrometer sind allgemein Mess- oder Analyseeinrichtungen zum spektroskopischen Untersuchen einer Probe. Optische Spektrometer nutzen Licht für die spektroskopische Untersuchung. Spektroskopische Untersuchungen mit Photonendichtewellen erlauben die getrennte Absolutbestimmung von Absorptions- und Streueigenschaften stark streuender Proben, die mit klassischen Methoden der Lichtstreuung oder der Absorptionsspektroskopie so nicht möglich sind. Unter Photonendichtewellen wird die zeit- und ortsabhängige Ausbreitung von Licht in einem stark streuenden Medium verstanden, welche durch die Anzahl der Photonen pro Volumen, also die Photonendichte charakterisiert ist.

**[0003]** Die Beschreibung der Photonenausbreitung lehnt sich an Untersuchungen über den Transport von Neutronen an, da sowohl Photonen als auch Neutronen ungeladen sind und sich, abgesehen von Streuprozessen, frei von äußeren Kräften bewegen. Allerdings vereinfacht sich die Beschreibung für Photonen wesentlich, da sie im Gegensatz zu Neutronen alle eine konstante und gleiche Geschwindigkeit besitzen. Ausgehend von der Strahlungstransportgleichung, in der alle Beiträge bilanziert werden, die zu einer Veränderung der Lichtintensität führen, wird meist eine Entwicklung in eine Reihe von Kugelflächenfunktionen verwendet, um eine einfache Beschreibung der Photonendichte zu erhalten. Hierbei tritt als charakteristische Größe analog zum Teilchentransport ein optischer Diffusionskoeffizient auf, der mittels Absorptions- und Streueigenschaften des Mediums beschrieben wird.

**[0004]** Da die Lichtausbreitung durch Absorption und Streuung charakteristisch beeinflusst wird, kann die Analyse von Photonendichtewellen zur Bestimmung dieser optischen Eigenschaften verwendet werden. Die bekannten experimentellen Techniken zur Nutzung von Photonendichtewellen können anhand der jeweils verwendeten Zeitabhängigkeit des eingestrahlten Lichtes unterschieden werden. Zum einen wird für Untersuchungen in der Zeitdomäne ein sehr kurzer Lichtimpuls in das Medium eingestrahlt, und dann wird ortsabhängig die Zeitabhängigkeit der Lichtausbreitung verfolgt. Zum anderen werden für Experimente in der Frequenzdomäne Lichtquellen verwendet, die in ihrer Intensität sinusförmig moduliert werden. Außerdem können Untersuchungen auch mit zeitlich konstanten Lichtquellen durchgeführt werden.

**[0005]** Die Spektroskopie auf Basis von Photonendichtewellen ist insbesondere zum Untersuchen stark streuender Medien mit relativ geringer Absorption geeignet. Einerseits gestattet hohe Streuung die Beschrei-

bung der Lichtausbreitung als zufälligen Teilchentransport. Andererseits verringert sich die Photonendichte bei starker Absorption so sehr, dass die Detektion schwierig wird. Untersuchungen mittels Photonendichtewellen werden deshalb häufig in einem Spektralbereich von 600 bis 900 nm durchgeführt, wo viele Materialien nur eine mäßige Absorption zeigen. Streuung wird durch örtliche Variation des Brechungsindex hervorgerufen und ist dann besonders stark, wenn die Größenskala der Variation der Wellenlänge des Lichtes entspricht und der Unterschied im Brechungsindex groß ist. Daher zeigen insbesondere Dispersionen aus Materialien mit unterschiedlichem Brechungsindex, deren disperse Phase aus Teilchen mit einem Durchmesser von über 50 nm besteht, im sichtbaren Spektralbereich eine starke Streuung.

**[0006]** Bei einem Spektrometer zur Untersuchung einer Probe mittels Photonendichtewellen wird üblicherweise Anregungslicht, welches von einer Lichtquelle erzeugt wird, beispielsweise einem Laser, mittels einer Einkoppeleinrichtung auf die zu untersuchende Probe eingekoppelt. Dieses erfolgt beispielsweise unter Verwendung eines Lichtwellenleiters in der Einkoppeleinrichtung. Eine Auskoppeleinrichtung dient dann dazu, in der zu untersuchenden Probe aufgrund des eingestrahlten Anregungslichtes entstehendes Messlicht auszukoppeln und an eine Detektionseinrichtung abzugeben. Auch die Auskoppeleinrichtung kann unter Verwendung eines oder mehrerer Lichtwellenleiter gebildet sein, in welche das Messlicht eingekoppelt wird, um es zu der Detektionseinrichtung zu leiten. Unter Verwendung physikalischer Modellbetrachtungen kann das detektierte Messlicht ausgewertet werden, um optische Eigenschaften der zu untersuchenden Probe zu ermitteln.

**[0007]** Dem Einkoppeln des Anregungslichtes und dem Auskoppeln des Messlichtes muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, um tatsächlich auswertbare Messlichtsignale zu empfangen.

### Zusammenfassung der Erfindung

**[0008]** Aufgabe der Erfindung ist es, eine Messanordnung für ein optisches Spektrometer, insbesondere ein Photonendichtewellen-Spektrometer, mit verbesserten Lichtein-/Lichtauskoppeleigenschaften anzugeben.

**[0009]** Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Messanordnung für ein optisches Spektrometer nach dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand von abhängigen Unteransprüchen.

**[0010]** Die Erfindung umfasst den Gedanken einer Messanordnung für ein optisches Spektrometer, insbesondere ein Photonendichtewellen-Spektrometer, mit einer Messkammer, welche mit einer zu messenden Probe beladbar ist, und einer Ein-/Auskoppeleinrichtung, die konfiguriert ist, Anregungslicht von einer Lichtquelle zu empfangen und auf die zu messende Probe in der Messkammer einzukoppeln und in der zu messende Probe

infolge des eingekoppelten Anregungslichtes gebildetes Messlicht zu empfangen und an eine Detektionseinrichtung abzugeben, wobei die Ein-/Auskoppeleinrichtung eine optische Schalteinrichtung und mehrere hieran koppelnde Lichtleiterelemente mit einem jeweiligen Lichtwellenleiter aufweist, die mittels der optischen Schalteinrichtung gemäß zumindest einer wählbaren Messkonfiguration beschaltbar sind, um der zumindest einen wählbaren Messkonfiguration entsprechend das Anregungslicht einzukoppeln und das Messlicht zu empfangen, und wobei Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente in Blickrichtung auf die Ausgänge einer spiralförmigen Anordnung entsprechend positioniert sind.

**[0011]** Es wurde überraschend gefunden, dass die spiralförmige Anordnung der Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente in besonderer Weise eine effiziente Einkopplung des Anregungslichtes sowie eine effiziente Auskopplung des Messlichtes unterstützt. Überspreekteffekte zwischen den mehreren Lichtleiterelementen sind minimiert. Die vorgeschlagene Anordnung der mehreren Lichtleiterelemente unterstützt darüber hinaus eine möglichst ungestörte Lichtausbreitung in der zu messenden Probe von dem oder den Lichtwellenleitern, welche das Anregungslicht einkoppeln, zu dem oder den Lichtwellenleitern, welche das Messlicht empfangen. Auf diese Weise kann die Anzahl der verwendeten Lichtwellenleiter erhöht werden, wodurch sich ein großer Bereich zugänglicher Abstände ergibt, was eine Anwendbarkeit für Proben mit stark unterschiedlichen optischen Eigenschaften ermöglicht.

**[0012]** Je nach Messkonfiguration können die mehreren Lichtleiterelemente mit Hilfe der optischen Schalteinrichtung im Rahmen einer Messaufgabe so eingerichtet werden, dass sowohl das Anregungslicht auf die zu messende Probe eingekoppelt als auch das Messlicht ausgekoppelt werden. Beispielsweise kann jedes der mehreren Lichtleiterelemente nacheinander zum Einkoppeln des Anregungslichtes und zum Empfangen des Messlichtes verwendet werden, indem die optische Schalteinrichtung eine entsprechende optische Beschaltung der mehreren Lichtleiterelemente realisiert. Auch kann alternativ vorgesehen sein, dass eines der mehreren Lichtleiterelemente für die Dauer der Messung zum Einkoppeln des Anregungslichtes beschaltet wird, wohingegen einige oder alle der verbleibenden Lichtleiterelemente dem Empfang von Messlicht und dessen Weiterleitung zur Detektionseinrichtung dienen. Eine gewählte Beschaltung, die einer Messkonfiguration entspricht, kann für die Dauer einer durchzuführenden Messung unverändert bleiben. In einer anderen Ausgestaltung ändert sich die Messkonfiguration im Verlauf einer Messung einmal oder mehrfach. Je nach Beschaltung des individuellen Lichtleiterelementes wird durch den zugehörigen Lichtwellenleiter eine bestimmte Lichtart geleitet, nämlich Anregungslicht oder Messlicht. Den vorangehenden Ausführungen entsprechend ist ein Verfahren zum spektroskopischen Untersuchen einer Probe, insbesondere eine Untersuchung mittels Photonendich-

tewellen, in verschiedenen Varianten ausführbar.

**[0013]** Optische Schalteinrichtungen sind als solche beispielsweise in Form von Faser-Faser-Schaltern bekannt, mit denen Faserenden von Lichtwellenleitern relativ zueinander so positioniert werden können, dass eine Übertragung von Licht aus einem Faserende in ein anderes Faserende entweder stattfindet oder nicht. Solche optischen Schalteinrichtungen nutzen beispielsweise Translationsschlitten, um die Faserenden relativ zueinander zu verlagern. Die vorgeschlagene Messanordnung kann je nach Anwendungsfall unter Verwendung unterschiedlicher optischer Schalteinrichtungen realisiert werden.

**[0014]** Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente relativ zu einer Bezugsebene quer zur Lichtaustrittsrichtung des Anregungslichtes aus den Ausgängen in unterschiedlichen Abständen angeordnet sind. Entlang der Ausbreitungsrichtung des Anregungslichtes sind die Ausgänge also versetzt zueinander gebildet. Hierbei kann auch vorgesehen sein, dass wenigstens zwei der Ausgänge im gleichen Abstand von der Bezugsebene angeordnet sind, wohingegen wenigstens ein anderer Ausgang relativ hierzu verschoben ist.

**[0015]** Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente in ihrer Lage relativ zueinander wenigstens für die zumindest eine Messkonfiguration fixiert sind. Die Fixierung der Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente relativ zueinander kann dauerhaft festgelegt sein. Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente relativ zueinander verlagerbar sind, beispielsweise mittels Verschieben, so dass die Relativpositionen zwischen unterschiedlichen Messungen oder sogar für verschiedene Messschritte innerhalb einer Messung neu eingestellt werden können, dann aber in fixierter Lage vorliegen. Eine Verlagerung relativ zueinander der Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente kann beispielsweise mittels geeigneter Translationsschlitten ausgeführt werden, die in als solchen bekannten Ausgestaltungen auch die notwendige Präzision einer solchen Relativverlagerung realisieren können.

**[0016]** Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass wenigstens ein Teil der Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente in der Messkammer angeordnet ist. Auf diese Weise ist es ermöglicht, dass der Teil der Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente, welcher in der Messkammer angeordnet ist, sogar in die zu untersuchende Probe eintaucht, was zusätzlich dadurch beeinflusst werden kann, dass der Füllgrad der Messkammer anwendungsabhängig eingestellt wird. Dieses kann für einige oder alle der in der Messkammer angeordneten Ausgänge je nach Messaufgabe vorgesehen sein.

**[0017]** Bevorzugt sieht eine Fortbildung der Erfindung vor, dass der Teil der Lichtleiterelemente, für den der Ausgang in der Messkammer angeordnet ist, fluiddicht

durch einen Wandabschnitt der Messkammer hindurch geführt ist. In einer fluiddichten Wanddurchführung können die Lichtleiterelemente feststehend oder verlagerbar, beispielsweise mittels Schieben oder Ziehen, angeordnet sein. Beispielsweise ist das Lichtleiterelement als Lichtwellenleiter in einer Dichtung aus einem elastischen Material wie Gummi oder Kautschuk geführt.

**[0018]** Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente von Lichtwellenleiter-Ausgängen der Lichtwellenleiter gebildet sind. Alternativ hierzu können den Lichtwellenleiter-Ausgängen optische Elemente vorgelagert sein, die dann ihrerseits den unmittelbaren Ausgang für das Lichtleiterelement bilden, durch welchen das Anregungslicht austritt oder das Messlicht eintritt. Vorgesehen sein können in diesem Zusammenhang beispielsweise Linsen oder Linsensysteme, welche dann den unmittelbaren Ausgang bilden.

**[0019]** Eine Weiterbildung der Erfindung kann vorsehen, dass die Lichtwellenleiter aus Lichtwellenleitern mit einem Gradienten-Index-Profil gebildet sind. Die Verwendung von Lichtwellenleitern mit einem Gradienten-Index-Profil ermöglicht die Verringerung einer Demodulation und hierdurch eine Verbesserung der Messlichtqualität bei höheren Frequenzen der Lichtmodulation oder der Verwendung längerer Lichtwellenleiter.

**[0020]** Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die Lichtwellenleiter aus photonischen Kristallfasern gebildet sind. Beispielsweise können photonische Kristallfasern in einer sogenannten *hollow-core*-Ausführung verwendet werden.

**[0021]** Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Lichtwellenleiter gemäß wenigstens einer der folgenden Bauarten ausgeführt sind: deuterierte Lichtwellenleiter und fluoridierte Lichtwellenleiter. Die Verwendung von Lichtleitern mit einer Deuterierung und / oder einer Fluoridierung ermöglicht die Verringerung einer Absorption und somit den Einsatz in einem breiteren Spektralbereich. Außerdem führt die verringerte Oberflächenenergie von fluoridierten Materialien zu einer geringeren Verschmutzung des Lichtwellenleiters und einer leichteren Reinigung.

**[0022]** Auch können Lichtwellenleiter vorgesehen sein, die in beliebiger Kombination mehrere der vorangehend genannten Ausgestaltungen in sich vereinen.

#### Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung

**[0023]** Die Erfindung wird im folgenden anhand von bevorzugten Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf Figuren einer Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung für eine Messapparatur unter Verwendung eines Photondichtewellen-Spektrometers,

Fig. 2 eine spiralförmige Anordnung von Ausgängen

mehrerer Lichtleiterelemente in Blickrichtung auf die Ausgänge und

Fig. 3 eine schematische Darstellung mit einer Messkammer und mehreren Lichtleiterelementen, deren Ausgänge in der Messkammer angeordnet sind.

**[0024]** Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Messapparatur unter Verwendung eines Photondichtewellen-Spektrometers (PDW-Spektrometer). Hierbei beziehen sich gepunktete Linien zwischen den Kästchen auf die Übertragung optischer Signale und durchgezogenen Linien zwischen den Kästchen auf die Übertragung elektrischer Signale.

**[0025]** Die Messapparatur ist konzeptionell in zwei Teile gegliedert, nämlich eine Emissionseinheit 1 und eine Detektionseinheit 2. Mittels der Emissionseinheit 1 wird unter Verwendung eines Frequenzgenerators 3 ein zeitabhängiges elektrisches Signal erzeugt, welches beispielsweise einen sinusförmigen Verlauf aufweist. Der Frequenzgenerator 3 erzeugt ein modulierte elektrisches Signal bei einer einstellbaren Frequenz. Die Frequenz liegt zwischen einigen Kilohertz und bis zu mehreren Gigahertz.

**[0026]** Mit Hilfe einer emissionsseitigen Signalkonditionierung 4 wird das von dem Frequenzgenerator 3 erhaltene elektrische Signal konditioniert und auf eine modulierbare Strahlungsquelle 5 gegeben, die das empfangene Signal in ein zeitabhängiges optisches Anregungslicht umwandelt. Je nach Strahlungsquelle wird das elektrische Signal zunächst konditioniert. Neben einer möglichen Verstärkung wird insbesondere über ein Biased-T ein zeitunabhängiges Signal addiert. Sollen mehrere Strahlungsquellen moduliert werden, kann ein elektronischer Hochfrequenzschalter für die gesteuerte Schaltung des Signals auf die einzelnen Strahlungsquellen vorgesehen sein.

**[0027]** Bei der modulierbaren Strahlungsquelle 5 handelt es sich beispielsweise um einen Laser, insbesondere ein oder mehrere Diodenlaser. Diese können direkt über den Laserstrom in ihrer Intensität moduliert werden. Weiterhin werden die Diodenlaser temperaturstabilisiert und ihre Intensität über eine Monitordiode überwacht. Die Strahlungsquelle 5 ist gegen elektromagnetische Ein- und Abstrahlung gesichert.

**[0028]** Das erzeugte Anregungslicht wird nach einer Konditionierung mittels einer emissionsseitigen Strahlkonditionierung 6 über emissionsseitige Strahlungstransportmittel 7 zu einer Einkoppeleinrichtung 8 geführt, von der das zeitabhängig modulierte Anregungslicht dann auf eine zu messende Probe in einer Messkammer 9 eingekoppelt wird. Der Strahlungstransport zur Probe erfolgt über Lichtwellenleiter. Hierbei wird auf eine geringe Demodulation, insbesondere bei hohen Frequenzen, sowie eine geringe Absorption bei der entsprechenden Wellenlänge geachtet. Durch den Lichtwellenleiter können erhebliche Entfernungen zwischen der Strahlungsquelle 5 und der Probe in der Messkammer 9 realisiert

werden. Die Verwendung von Lichtwellenleitern mit einem Gradienten-Index-Profil oder photonischer Kristallfasern, zum Beispiel in *hollow-core*-Ausführung, erlaubt eine Verringerung der Demodulation und somit eine Verbesserung des Messsignals bei höheren Frequenzen oder eine Verwendung längerer Lichtwellenleiter. Die Verwendung von fluorierten oder / und deuterierten Lichtleitern ermöglicht die Verringerung der Absorption und somit einen breiteren spektralen Einsatzbereich. Außerdem führt die verringerte Oberflächenenergie von fluorierten Materialien zu einer geringeren Verschmutzung der Lichtwellenleiter und einer leichteren Reinigung.

**[0029]** In der Detektionseinheit 2 wird Messlicht, welches in der Probe aufgrund des Einkoppelns des zeitabhängigen Anregungslichtes erzeugt wird, mit Hilfe einer Auskoppereinrichtung 10, welche ihrerseits integriert mit der Einkoppereinrichtung 8 integriert ausgeführt ist, ausgekoppelt und über detektionsseitige Strahlungstransportmittel 11 zu einer detektionsseitigen Strahlkonditionierung 12 und anschließend dann auf einen Detektor 13 geleitet wird. Die Auskopplung aus der Probe erfolgt wiederum über einen oder mehrere Lichtwellenleiter. Diese werden über einen optischen Schalter auf einen gemeinsamen Lichtwellenleiter geschaltet oder über einen Translationsschlitten gezielt in ihrer Position in der Probe verändert werden. Der weitere Strahlungstransport von der Probe erfolgt über einen Lichtwellenleiter. Obige Erläuterungen zum Strahlungstransport des Anregungslichtes zu der Probe gelten entsprechend.

**[0030]** Die zu detektierende Messlichtstrahlung wird entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Anwendung noch weiter konditioniert. So kann neben einer spektralen Filterung mittels eines (Interferenz-)filters oder auch über dichroitische Spiegel eine Aufteilung auf mehrere Detektoren erreicht werden. Dazu wird üblicherweise das optische Signal aus dem Lichtwellenleiter über eine Linse (nicht dargestellt) zunächst parallelisiert.

**[0031]** Das empfangene Messlicht wird von dem Detektor 13 schließlich in ein elektrisches Messsignal umgewandelt, welches seinerseits dann mit Hilfe einer detektionsseitigen Signalkonditionierung konditioniert wird, um es schließlich auf einen phasensensitiven Detektor 15 zu geben. Je nach Spektralbereich und sonstigen Bedingungen erfolgt die Umwandlung des optischen in ein elektrisches Signal über Avalanche- oder PIN-Dioden oder Photomultiplier. Dabei ist neben der zeitlichen Auflösung und spektralen Empfindlichkeit ein weiterer linearer Bereich, geringes Amplituden-Phasen-Übersprechen und eine gute elektromagnetische Abschirmung erforderlich. Das elektrische Signal des Detektors 13 wird über einen Hochpass von der zeitlich unabhängigen Komponente befreit und über einen Hochfrequenzverstärker verstärkt, was mittels einer detektionsseitigen Signalkonditionierung 14 ausgeführt wird. Hierbei kann das zeitunabhängige Signal zusätzlich ausgewertet werden. Der phasensensitive Detektor 15 bestimmt die Amplitude und Phase des detektierten Signals relativ zum Signal, dass der Frequenzgenerator 3 erzeugt. Der Frequenz-

generator 3 und phasensensitiver Detektor 15 sind in einem Netzwerkanalysator kombiniert.

**[0032]** Einzelne Komponenten der Messapparatur in Fig. 1 können über einen Personalcomputer gesteuert werden, auf dem auch eine nähere Auswertung der Messsignale erfolgt, so dass schließlich ein optischer Absorptionskoeffizient und ein effektiver optischer Streukoeffizient ermittelt werden können. Hieraus abgeleitet können darüber hinaus andere Probenparameter ermittelt werden wie Konzentration von Teilchen oder Teilchengröße.

**[0033]** Fig. 2 zeigt Ausgänge mehrerer optischer Lichtleiterelemente in Blickrichtung auf die Ausgänge. Die mehreren Lichtleiterelemente werden verwendet, um einerseits das Anregungslicht auf die zu untersuchende Probe einzukoppeln und andererseits auch das in der Probe entstandene Messlicht aus dieser auszukoppeln und dann zu dem Detektor 13 abzugeben. Fig. 2 zeigt stirnseitige Enden von Lichtwellenleitern, die je nach Messaufgabe und gewählter Messkonfiguration zum Abgeben des Anregungslichtes zu der Probe oder zum Empfangen des Messlichtes aus der Probe genutzt werden können. Die der jeweiligen Messkonfiguration entsprechende Nutzung der einzelnen Lichtleiterelemente erfolgt mittels entsprechender Beschaltung, die ihrerseits mit einer optischen Schalteinrichtung (nicht dargestellt) realisiert wird, beispielsweise einem Faser-Faser-Schalter. Hierbei kann zum Beispiel ein innerer Lichtwellenleiter 20 zum Einkoppeln des Anregungslichtes genutzt werden, wohingegen verbleibende Lichtwellenleiter zum Empfang des Messlichtes dienen. Auch eine umgekehrte Ausführung kann vorgesehen sein. Weiterhin können die mehreren Lichtwellenleiter nacheinander als Lichtwellenleiter für das Anregungslicht und Lichtwellenleiter für das Messlicht verwendet werden. Der die verschiedenen Messkonfigurationen realisierende, optische Schalter kann beispielsweise unter Verwendung eines Translationsschlittens ausgeführt sein. Verschiedene Ausgestaltungen derartiger optischer Schalteinrichtungen sind als solche bekannt.

**[0034]** Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung mit einer Messkammer 30 und mehreren Lichtleiterelementen 31, deren Ausgänge in der Messkammer 30 angeordnet sind. Alternativ können die Ausgänge von oben in die Messkammer 30 hineinragen.

**[0035]** Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und der Zeichnung offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen von Bedeutung sein.

## Patentansprüche

1. Messanordnung für ein optisches Spektrometer, insbesondere ein Photonendichtwellen-Spektrometer, mit:

- einer Messkammer (9; 30)), welche mit einer zu messenden Probe beladbar ist, und  
 - einer Ein-/Auskoppeleinrichtung (8, 10), die konfiguriert ist, Anregungslicht von einer Lichtquelle (5) zu empfangen und auf die zu messende Probe in der Messkammer (9; 30) einzukoppeln und in der zu messende Probe infolge des eingekoppelten Anregungslichtes gebildetes Messlicht zu empfangen und an eine Detektionseinrichtung (13) abzugeben,

wobei die Ein-/Auskoppeleinrichtung (8, 10) eine optische Schalteinrichtung und mehrere hieran kopplende Lichtleiterelemente mit einem jeweiligen Lichtwellenleiter aufweist, die mittels der optischen Schalteinrichtung gemäß zumindest einer wählbaren Messkonfiguration beschaltbar sind, um der zumindest einen wählbaren Messkonfiguration entsprechend das Anregungslicht einzukoppeln und das Messlicht zu empfangen, und wobei Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente in Blickrichtung auf die Ausgänge einer spiralförmigen Anordnung entsprechend positioniert sind.

2. Messanordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente relativ zu einer Bezugsebene quer zur Lichtaustrittsrichtung des Anregungslichtes aus den Ausgängen in unterschiedlichen Abständen angeordnet sind. 25  
30
3. Messanordnung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente in ihrer Lage relativ zueinander wenigstens für die zumindest eine Messkonfiguration fixiert sind. 35
4. Messanordnung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** wenigstens ein Teil der Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente in der Messkammer (30) angeordnet ist. 40
5. Messanordnung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Teil der Lichtleiterelemente, für den der Ausgang in der Messkammer (30) angeordnet ist, fluiddicht durch einen Wandabschnitt der Messkammer (30) hindurch geführt ist. 45
6. Messanordnung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ausgänge der mehreren Lichtleiterelemente von Lichtwellenleiter-Ausgängen der Lichtwellenleiter gebildet sind. 50  
55
7. Messanordnung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtwellenleiter aus Lichtwellenleitern mit

einem Gradienten-Index-Profil gebildet sind.

8. Messanordnung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtwellenleiter aus photonischen Kristallfasern gebildet sind. 5
9. Messanordnung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtwellenleiter gemäß wenigstens einer der folgenden Bauarten ausgeführt sind: deuterierte Lichtwellenleiter und fluorierte Lichtwellenleiter. 10
10. Photonendichtewellen-Spektrometer, **gekennzeichnet durch** eine Messanordnung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche. 15  
20

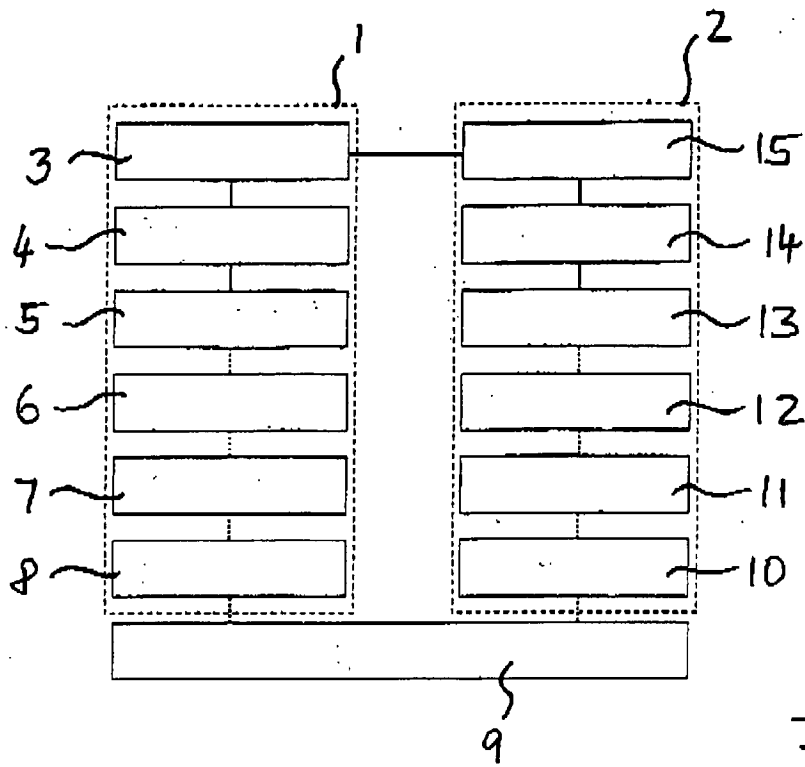


Fig. 1

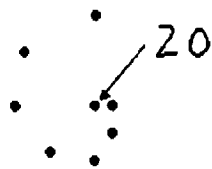


Fig. 2

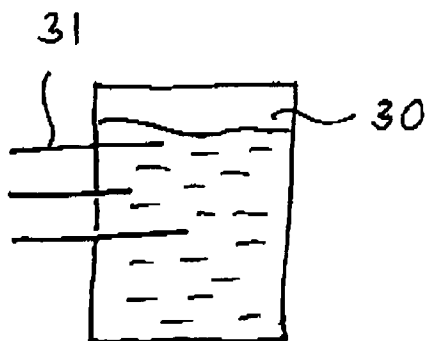


Fig. 3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 07 01 8676

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile                                                                                                                     | Betrifft Anspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)                    |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EP 0 843 986 A (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]) 27. Mai 1998 (1998-05-27)<br>* Spalte 6, Zeile 6 - Spalte 7, Zeile 13 *<br>* Spalte 15, Zeile 19 - Zeile 54 *<br>* Abbildungen 1,2,29,30 *<br>----- | 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INV.<br>G01J3/44<br>G01J3/02<br>G01N21/17<br>A61B5/00 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US 7 054 002 B1 (SEVICK-MURACA EVA M [US] ET AL) 30. Mai 2006 (2006-05-30)<br>* Spalte 3, Zeile 61 - Spalte 5, Zeile 63 *<br>*<br>* Abbildung 1 *                                                       | 1,2,4,5,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US 5 452 723 A (WU JUN [US] ET AL) 26. September 1995 (1995-09-26)<br>* Spalte 6, Zeile 8 - Zeile 36 *<br>* Abbildung 4 *                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US 2006/089556 A1 (BAMBOT SHABBIR B [US] ET AL) 27. April 2006 (2006-04-27)<br>* Absatz [0058] - Absatz [0115] *<br>* Abbildungen 1-11 *                                                                | 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US 5 987 351 A (CHANCE BRITTON [US]) 16. November 1999 (1999-11-16)<br>* Spalte 6, Zeile 66 - Spalte 14, Zeile 41 *<br>*<br>* Abbildungen 1-5 *<br>-----                                                | 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G01J<br>A61B<br>G01N                                  |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Recherchenort<br><b>München</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         | Abschlußdatum der Recherche<br><b>7. März 2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prüfer<br><b>Haller, Mirjam</b>                       |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE<br>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br>A : technologischer Hintergrund<br>O : mündliche Offenbarung<br>P : Zwischenliteratur |                                                                                                                                                                                                         | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument<br>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument<br>.....<br>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |                                                       |

1  
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 07 01 8676

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

07-03-2008

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentedokument | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EP 0843986 A                                        | 27-05-1998                    | CN 1184936 A                      | 17-06-1998                    |
|                                                     |                               | DE 69728236 D1                    | 29-04-2004                    |
|                                                     |                               | DE 69728236 T2                    | 02-12-2004                    |
|                                                     |                               | HK 1011559 A1                     | 04-04-2003                    |
|                                                     |                               | JP 11070101 A                     | 16-03-1999                    |
|                                                     |                               | US 6016435 A                      | 18-01-2000                    |
| US 7054002 B1                                       | 30-05-2006                    | KEINE                             |                               |
| US 5452723 A                                        | 26-09-1995                    | KEINE                             |                               |
| US 2006089556 A1                                    | 27-04-2006                    | AU 6139199 A                      | 03-04-2000                    |
|                                                     |                               | CA 2343401 A1                     | 23-03-2000                    |
|                                                     |                               | EP 1112022 A1                     | 04-07-2001                    |
|                                                     |                               | JP 2003512085 T                   | 02-04-2003                    |
|                                                     |                               | WO 0015101 A1                     | 23-03-2000                    |
| US 5987351 A                                        | 16-11-1999                    | KEINE                             |                               |

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

|               |                                                           |         |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)       | 用于光学光谱仪的测量组件                                              |         |            |
| 公开(公告)号       | <a href="#">EP2040050A1</a>                               | 公开(公告)日 | 2009-03-25 |
| 申请号           | EP2007018676                                              | 申请日     | 2007-09-24 |
| 申请(专利权)人(译)   | Universität大学波茨坦                                          |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译) | Universität大学波茨坦                                          |         |            |
| [标]发明人        | REICH OLIVER DR<br>LOHMANNROBEN HANS GERD PROF            |         |            |
| 发明人           | REICH, OLIVER. DR.<br>LÖHMANNSRÖBEN, HANS-GERD, PROF. DR. |         |            |
| IPC分类号        | G01J3/44 G01J3/02 G01N21/17 A61B5/00                      |         |            |
| CPC分类号        | G01J3/44 A61B5/0059 G01J3/02 G01J3/0218 G01J3/0297        |         |            |
| 其他公开文献        | EP2040050B1                                               |         |            |
| 外部链接          | <a href="#">Espacenet</a>                                 |         |            |

#### 摘要(译)

该组件具有耦合/解耦装置，该耦合/解耦装置接收由于耦合在测量室中并提供给检测装置的激发光而形成的测量光。耦合/解耦装置具有光学开关装置和具有内部光纤电缆（20）的光纤元件。根据可选择的测量配置，通过开关装置切换电缆，用于耦合对应于激发光的配置和用于接收测量光。元件的输出在观察方向上定位在螺旋布置的输出上。

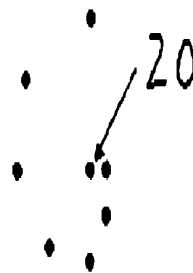


Fig.2